

SiN_x

SiN

11925

Mulliken R.

Phys. Rev. 26, 319.

Изогирическим дигидрол 6
водородом заменены
IV Синтепон H_2N

SiN

Clark

1940

Trans. Far. Soc., 36, 370

Do

V. Взаимоотношения между
ними диссоциирующие и
равновесного. неоднород-
ного состояния двух-
атомных молекул в
основной состоянию.



Budapest, Múzeum

1954

$\text{Si}(\text{N}_3)_4$ Wiberg E., Michael H.
Z. Naturforsch., 1954, 9b, N° 7,
500.

O měření průchodu křemíku $\text{Si}(\text{N}_3)_4$.

x- 55-4-11453.

SiN

Margrove Y.L.
Sthapitanonda P.

1955

Do

Y.Ph. Ch., 59, N12, 1231

расторопчаевое цветущее
цеманов I. meopetier
настремо цветущее густоцвет-
нущее глыжанистое
семпред gob.

(Coll. SiN) III

Si - N

БОР-3230-VI

1961

Сильванецк Н.Н.
Бесин О.А.

Физ. Кин. вспомог. физик.
стали, АИ СССР, Ижст
длем. Тб, бой конф. № 00162,
1961, 395-9.



1962

5877

D₀ (SiN)

Laud B.B.

Indian J.Phys., 1962, 36, N 12,
639-649

On the relation...

M, J

1962

42M

C, W, Mo, Nb, HfB₂; TaB₂; TiB₂; WB;
ZrB₂; HfC; HfG; Mo₂G; TaC; TiC; WC; VC; ZrC;
BN; HfN; SiN; TaN; TiN; ZrN; CeO₂; HfO₂; MgO;
ZrO₂; ZrSiO₄. (Cp)

Neel D.S., Pears C.D.

Progr. Intern. Res. Thermodyn. Transport
Properties, Papers Symp. Thermophys. Prop-
erties, 2nd, Princeton, N.J., 1962,

500-11

Be

Measurement..

1962

 $(Si_6N_2)_n$

9 В13. О получении нового субнитрида кремния $(Si_6N_2)_n$. Hengge-E. Über die Darstellung eines neuen Siliciumsubnitrides $(Si_6N_2)_n$. «Z. anorgan. und allgem. Chem.», 1962, 315, № 5-6, 298—304 (нем.; рез. англ.)

Тонкоизмельченный $CaSi_2$ реагирует с галогенидами NH_4 в тонкоизмельченном состоянии при нагревании с образованием $(Si_6N_2)_n$ и соответствующего галогенида Ca. Р-ция протекает при т-ре, близкой к т-ре сублимации соли NH_4 . Количественно изучена р-ция с NH_4Br как наиболее легко протекающая. Анализом и сопоставлением дебаеграмм $CaBr_2$ и полученного в-ва показано образование при р-ции $CaBr_2$. Предложено следующее ур-ние р-ции: $3CaSi_2 + 6NH_4Br \rightarrow 3CaBr_2 + 2Si_3N + 4NH_3 + 6H_2$. В качестве возможной модели структурной единицы Si_6N_2 предложен шестичленный цикл из атомов Si (подобно циклогексану) в форме кресла, причем связи с атомами N расположены над и под плоскостью кольца.

Т. Ермакова

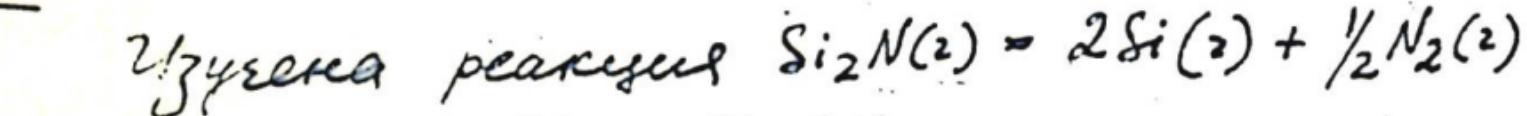
X. 1963. 9

K. I. Zmbov, J. L. Margrave

1967

УАСС, 89, 2492
Масс-спектрометрические данные для

Si₂N₂ в газе. [ОТЧЕТ 429]



в интервале 1742 - 1846 °К.

Получено:

$$\Delta H_{\text{реакции } 298}^{\circ} = 123,5 \pm 1,0 \text{ (по III-му закону).}$$

$$\Delta H_{\text{удл}_{298}}^{\circ}(Si) = 108,4 \pm 3,0 \frac{\text{ккал}}{\text{моль}} - \text{литр.газовое}$$

Отчет 429

Сер. на одобре.

$$\Delta H^\circ [Si_2N(2)] = 93 \pm 5 \frac{ккал}{моль}$$

образован, 298

$$\Delta H^\circ [Si_2N(2)] = 236 \pm 10 \frac{ккал}{моль}$$

афориз. 298

1969

Si₂N₂

8 B11. Нитрид кремния, Si₂N₂. Billy Michel,
Goursat Paul. Le nitru^e de silicium Si₂N₂. «C. R.
Acad. sci.», 1969, C269, № 16, 919—920 (франц.)

При выдерживании в течение 1000 час. в вакууме при 60° смеси Si₂(NH)₃+6 NH₄Cl, с послед. многократной промывкой продуктов р-ции жидк. NH₃ для удаления NH₄Cl получен белый тонкий порошок состава Si₂N₂·NH₃ (I). На основании ИК-спектра I установлено, что NH₃ хемисорбирован на связи Si—Si. В вакууме при 250° I медленно теряет NH₃, через месяц образуется Si₂N₂ (II) в виде белого легкого рентгеноаморфного порошка. Следы H₂O разлагают II с образованием SiO₂, NH₃ и H₂. Выше 290° в вакууме II разлагается, продуктом термолиза при 650° является SiN, который выше 1250° превращается в α-Si₃N₄. II взаимодействует с O₂ начиная с 175°.

И. Н. Семенов

Х. 1970. 8

Si₂N₂

1970

20 B29. Исследование нитридов кремния. II. Получение и идентификация нитрида Si_2N_2 . Billy Michel, Goursat Paul. Recherches sur les nitrures de silicium. II. Préparation et définition du nitrure Si_2N_2 . «Rev. chim. minér.», 1970, 7, № 1, 193—206 (франц.; рез. англ., нем.)

напечатано

Нитрид Si_2N_2 (I), содержащий связь Si—Si, получен вакуумным дезаминированием $\text{Si}_2(\text{NH})_3$ в присутствии NH_4Cl при 60° . Очистка I проведена экстракцией в жидк. NH_3 ; при этом образуется $\text{Si}_2\text{N}_2 \cdot \text{NH}_3$, к-рый при термолизе (250° , вакуум) переходит в I. Выше 290° происходит разрыв связи Si—Si в I и образуется SiN , к-рый при более высоких т-рах переходит в $\alpha-\text{Si}_3\text{N}_4$. Сообщ. I см. РЖХим, 1962, 9B10.

Резюме

X. 1970. 20

$\text{Si}_2\text{N}(r)$

Af

1971

2772-IVTKB

Шевченко В.А.

Экспериментальные образцы кристаллов
и когерентные конфигурации $\text{Si}_2\text{N}(r)$, Зе.

SiN(Cr) Do

1974

2771-IVTKB

Венг Н.В.

Энергия диссоциации SiN, кс.

SiN_g) Lemnuck 9581 1972
Si-N Peadley F. B., Yeard B.S.
coeg. CATCH tables. silicon
Compounds Sussex,
Univ. of Sussex, Brighton,
M.G.CB-6a 1972

1973

Si₁₁N₂

143316d Properties and bonding of undecasulfur dinitride.
 Shahid, M. S.; Heal, H. G.; Garcia-Fernandez, H. (Queen's Univ. Belfast, Belfast, N. Ire.). *J. Inorg. Nucl. Chem.* 1973, 35(5), 1693-6 (Eng). The mass spectrum of Si₁₁N₂ contains peaks of Si₁₁N₂⁺, S₆N₂⁺, S₅⁺, S₃N₂⁺, S₂N⁺, and S₂⁺. The solv. curves for α - and β -Si₁₁N₂ cross at $\sim 21^\circ$, with the β -form more sol. at $< 21^\circ$. The heat for the α - β transition is 10 kJ mole⁻¹. The heat of formation of Si₁₁N₂ is 282 kJ mole⁻¹. The N atoms of Si₁₁N₂ are sp² hybridized with p_z electrons involved in π -bonding to neighboring S atoms.

T_{t2}; 1H_{t2}1H_f

C.L. 1973.78 N22

$\text{Si}_2 N^+$

1977

Rosenstock H. M. et al

T.-g. J. Phys. Chem. Ref. Data,
CB-6a 1977, 6. Suppl. v1, p 1-384

SiN

1983

) 4 E554. Структурные превращения нитрида кремния при нагревании. Modifications structurales du nitrite de silicium en fonction de la température. Billy Michel, Labbe Jean-Claude, Selvaraj Alphonso, Roult Georges. «Mater. Res. Bull.», 1983, 18, № 8, 921—934 (фр.; рез. англ.)

Методом дифракции нейтронов с использованием времяпролетного детектора исследованы две кристаллич. модификации SiN в интервале т-р от комнатной до 900° С. При повышении т-ры относит. изменения параметров решетки и объема элементарной ячейки подчиняются квадратичной зависимости и близки для обеих модификаций. При нагревании существенно изменяется положение одного из атомов Si и одного из атомов N. Однако это приводит к значительному изменению взаимного расположения тетраэдров из атомов N, внутри которых расположен атом Si, и обусловли-

*структурн.
превращен.*

φ. 1984, 18, № 4

ваёт возникновение мёханич. напряжений в кристаллах SiN. Значительное различие в величинах механич. напряжений, возникающих при нагревании, для двух фаз SiN определяет различие в реакционной способности каждой из этих фаз при повышенных т-рах и необратимость фазового перехода. Библ. 23.

В. Е. Асадчиков

Si₃N

1983

6 Б2257. Микроструктуры Si₃N, полученного химическим осаждением из паровой фазы. Ніага Кенji. «Нихон киндзоку гаккай кайх», Bull. Jap. Inst. Metals», 1983, 22, № 7, 635—639 (яп.)

Методами электронной микроскопии высокого разрешения исследованы микроструктуры α - и β -Si₃N, полученных хим. осаждением из паровой фазы на Пв TiN. Выявлены дефекты решетки и межзеренные границы.

Л. Н. Демьянец

*микрострук-
тур*

X. 1984, 19, N6

SiN [Om. 19719]

1984

Foster S.C.,

γ Mol. Spectrosc.,
1984, 106, N2, 369 -
375.



Нитрид Si

1987

9 Б3092. Термическая стабильность нитрида кремния. Кислый П. С., Крыль Я. А., Филипенко В. М. «Сверхтверд. матер.», 1987, № 6, 29—34

Экспериментально исследовано влияние состава и давл. газовой среды на термическую стабильность порошков нитрида кремния различного происхождения. Установлена зависимость характера диссоциации от дисперсности порошка и содержания в нем примесей. Объясняется несоответствие результатов экспериментов и данных термодинамич. расчетов, определяющих обл. парц. давл. и т-р термич. стабильности нитрида кремния.

Резюме

kp;

Х. 1988, 19, № 9

Si₃N₄

1987

9 ъз121. Кинетическая модель осаждения из газовой фазы SiCl₄, NH₃ и H₂ пленок нитрида кремния. The kinetic model of chemical vapor deposition of silicon nitride films using SiCl₄, NH₃, and H₂ / Yi K.-S., Chun J. S. // Proc. 10th Int. Conf. Chem. Vapor Deposit., 1987.— Pennington (N. Y.), 1987.— С. 570—578.— Англ. Место хранения ГПНТБ СССР

Из газ. фазы SiCl₄—NH₃—H₂ с давл. 200—500 Торр при т-рах 873—1173 К на подложках из Si (легированных В, электросопротивление их 6—9 Ом·см) получены Пл осадка Si₃N₄. Кинетич. модель этой р-ции выведена из предположения о контролирующем характере р-ции на Пв и о незначительности гомог. р-ции. Скорость осаждения пропорциональна парц. давл. SiCl₄, является ф-цией квадрата парц. давл. H₂ и пропорциональна квадрату общего давл. Исследовано также влияние времени осаждения, скорости потока газ. фазы и т-ры осаждения. Данные, полученные путем вычисления по предложенной кинетич. модели, согласуются с экспериментом. Кажущаяся энергия активации осаждения Пл составила 22±0,5 ккал/моль.

В. А. Ступников

Модель
осаждения

у. 1990, № 9

LiN-

(M. 32807)

1989

Peterson R.A., Woods R.C.,

Ae, Ap. J. Chem. Phys. 1989,
90, N 12, 7239 - 7250.

Do found state spect-
roscopic and thermodyna-
mic properties of AlO^- ;

LiN^- , O^- , BS^- , BD^- and
 CN^- from Moller-Plesset
perturbation theory

SiN

1989

3 Б1029. Истинная кривая потенциальной энергии и
энергии диссоциации молекулы SiN, имеющей астрофизи-
ческое значение. True potential energy curve and dis-
sociation energy of astrophysically significant ~~SiN~~-mole-
cule / Rajamanickam N. // Acta Cien. Indica. Phys.—
1989.— 15, № 3.— С. 139—144.— Англ.

См. пред. реферат.

*Кривая
потенци-
альности,
д.*

X. 1991, № 3

Si₃N₄

1990

18 Б3007. Термоемкость материалов на основе нитрида кремния / Блиндер А. В., Болгар А. С., Трофимова Ж. А., Петровский В. Я. // Конструкции и технол. получ. изделий из немет. матер.: Тез. докл. 12 Всес. конф., Обнинск, 26—28 нояб., 1990. Ч. 1.— М., 1990.— С. 88.— Рус.

В интервале т-р 150—670 К исследована теплоемкость двух образцов нитрида кремния Si₃N₄ («Штарк») и Si₃N₄ (спек-310), а также трех материалов: Si₃N₄+5% Al₂O₃+2,5% TiN (1), Si₃N₄+5,3% Al₂O₃+2,7% Y₂O₃ (2) и Si₃N₄+3,5% Al₂O₃+10,5% Y₂O₃ (3). Показано, что теплоемкость двух нитридов в изученном интервале т-р совпадает в пределах погрешности измерений. Теплоемкость композиций (1) в среднем на 25% ниже, чем у исходного Si₃N₄ и (3), и на 20% ниже, чем у (2).

(lp)

X. 1991, N 18

SiN

1988

З Б1028. Истинная кривая потенциальной энергии и энергия диссоциации молекулы SiN, имеющей астрофизическое значение. True potential energy curve and dissociation energy of astrophysically significant SiN molecule / Rajamanickam N. // Acta Cien. Indica. Phys. — 1988. — 14, № 1. — С. 18—22.— Англ.

По экспериментальным значениям колебат. частот методом Ридберга — Клейна — Риса получена кривая потенциальной энергии молекулы SiN. На основе аппроксимации этой кривой трехпараметрич. модифицир. ф-цией Липпинкотта определена энергия диссоциации $SiN \ D_0^0 = 4,83 \pm 0,16$ эВ. Обсуждена астрофиз. роль этой молекулы.

А. А. Сафонов

III. 1. № 0

X. 1991, № 3

Li₃N

[Om. 38841]

1997

Karl A. Fingerich, R. Viswanathan et al.,

(K_p, S_{PS}) J. Chem. Phys., 1997, 106(14),
6016 - 6019.

SiN (K)

1991

120: 200703q Model for GO LCAO and polymorphism of silicon nitride. Andreeva, T. V.; Goryachev, Yu. M.; Bartnitskaya, T. S. (USSR). *Teoriya Elektron. Stroeniya i Svoistva Perekhod. Met., Splavov i Soed. AN USSR. Inst. Probl. Materialoved.*, Kiev 1991, 19-22 (Russ). From Ref. Zh., Khim. 1992, Abstr. No. 4B3219.
Title only translated.

(помемор -
ФЧМ)

C.A. 1994, 120, N 16

SiN

1991

117: 9760Sz Model of group orbitals-linear combination of atomic orbitals and polymorphism of silicon nitride. Andreeva, T. V.; Goryachev, Yu. M.; Bartnitskaya, T. S. (USSR). *Teoriya Elektron. Stroeniy i Svoistva Perekhod. Met., Splavov i Soed. AN USSR. In-t Probl. Materialoved.*, Kiev 1991, 19-22 (Russ). From *Ref. Zh., Metall.* 1992, Abstr. No. 1E118. Title only translated.

(NOMENCL -
PHYSIC)

C.A. 1992, 117, N10

Si_3N_4

1991

21 Б3058. Термодинамический анализ состава конденсированных продуктов в системе Si—N—C—H / Варламов А. Г., Ширяев А. А., Григорьев Ю. М. // Изв. АН СССР. Неорган. матер.— 1991.— 27, № 6.— С. 1222—1225.— Рус.

Проведен термодинамич. анализ системы Si—C—N—H. Показана возможность получения как однофазных продуктов (Si_3N_4 , SiC_k , C_k), так и совместного выделения неск. конденсированных фаз. Определены границы обл. существования конденсированных продуктов и влияние на них т-ры, соотношения исходных компонентов, общего давления. Показано, что влияние соотношения исходных компонентов удобно характеризовать атомными отношениями N/Si и H/C. Установлено, что N/Si ответственно за образование однофазного (Si_3N_4) либо двухфазного (Si_3N_4 — SiC_k) конденсированных продуктов. Отношение H/C определяет возмож-

(kp)

X. 1991; № 21

ность выделения фазы конденсированного углерода (при $H/C < 600$) и сдвигает высокот-ные границы обл. существования фаз SiC_k и C_k в сторону более низких т-р. «Чистый» нитрид кремния (без соосаждения др. конденсированных продуктов) образуется при избытке азота ($N/Si > 1,5$) и низких (ниже 1100 К) т-рах. Уменьшение общ. давления сдвигает высокот-ную границу обл. выхода нитрида кремния в сторону более низких температур.



Si₃N₄

1992

18 Б3047. Применение термического анализа с постоянной скоростью (ПСТА) для синтеза нитрида кремния карботермическим восстановлением диоксида кремния. Application of constant rate thermal analysis (CRTA) to the synthesis of silicon nitride by carbothermal reduction of silica / Alcalá M. D., Real C., Criado J. M. // J. Therm. Anal.— 1992.— 38, № 3.— С. 313—319.— Англ.; рез. нем.

Методом ПСТА в сочетании с ИК-спектроскопией и РФА изучены условия синтеза Si_3N_4 (I) карботермическим восстановлением SiO_2 (II) в токе азота. Исходные образцы II и углерода обладали след. уд. ПВ: 280 и 1500 при коми. т-ре и 1 и $800 \text{ м}^2/\text{г}$ при т-ре 1400°C соотв., конц-ия отходящего $\text{CO} \sim 0,53\%$ (скорость р-ции $1,6 \cdot 10^{-3} \text{ мин}^{-1}$). Установлено, что синтезу а-І способствует уменьшение константы скорости р-ции, увеличение парц. давл. CO .

Л. Г. Титов

X. 1992, N 18

Si₂N

1995

(Δ_fH₂₉₈)

124: 186819f The standard molar atomization enthalpy and the standard molar enthalpy of formation of gaseous Si₂N from high-temperature mass spectrometry. Viswanathan, R.; Schmude, R. W., Jr.; Gingerich, K. A. (Dep. Chem., Texas A & M Univ., College Station, TX 77843-3255 USA). *J. Chem. Thermodyn.* 1995, 27(12), 1303-11 (Eng). A high-temp. mass-spectrometric study of the vaporization of (silicon + boron nitride) from a boron-nitride Knudsen cell was conducted in the temp. range T = 1688 K to 1921 K. The partial pressures of Si(g), Si₂(g), N₂(g), and Si₂N(g) were detd. The dissociation reaction: Si₂N(g) = 2Si(g) + 0.5N₂(g) was evaluated by using new thermal functions for Si₂N(g) calcd. from the results of recent theor. and exptl. studies, and Δ_fH_m[°] values: (538.0 ± 12.4) kJ·mol⁻¹ at T → 0, and (545.1 ± 12.4) kJ·mol⁻¹ at T = 298.15 K were deduced by third-law evaluation. These values, in combination with the molar dissociation enthalpy of N₂(g) yielded the molar atomization enthalpies: Δ_{at}H_m[°](Si₂N, g) = (1008.8 ± 12.4) kJ·mol⁻¹ at T → 0, and (1017.8 ± 12.4) kJ·mol⁻¹ at T = 298.15 K, and in combination with the std. molar enthalpy of formation of Si(g) yielded: Δ_fH_m[°](Si₂N, g) = (354.0 ± 14.8) kJ·mol⁻¹ at T → 0, and (355.6 ± 14.8) kJ·mol⁻¹ at T = 298.15 K.

C.A. 1996, 124, N 14

Si₃N

1997

127: 10678g A Knudsen effusion mass spectrometric study of the molecule Si₃N. Gingerich, Karl A.; Viswanathan, R.; Schmude, Richard W., Jr. (Dep. Chem., Texas AM Univ., College Station, TX 77843 USA). *J. Chem. Phys.* 1997, 106(14), 6016–6019 (Eng), American Institute of Physics. Condensed phase mixts. (Ge + Si + Si₃N₄) and (Si + Si₃N₄) were evapd. from BN Knudsen cells and the partial pressures of Si₃N(g), Si₂N(g), and Si(g) were measured with a mass spectrometer at 1770–2000 K. The thermal functions for Si₃N(g) were calcd. from theor. mol. consts., and the enthalpy change was calcd. for the dissociation reaction: Si₃N(g) = Si₂N(g) + Si(g) detd. With the revised atomization enthalpy of Si₂N(g), $\Delta_{atom}H_m^\circ = 1011 \pm 12 \text{ kJ mol}^{-1}$ at T = 0 K and $1020 \pm 12 \text{ kJ mol}^{-1}$ at T = 298.15, the atomization enthalpy of Si₃N(g) was derived as $1298 \pm 19 \text{ kJ mol}^{-1}$ at T = 0 K and $1312 \pm 19 \text{ kJ mol}^{-1}$ at T = 298.15 K. These values in combination with the enthalpies of formation of Si(g) and N(g) yielded the enthalpies of formation $\Delta_fH_{m_0}$ at T = 298.15 K: $352 \pm 15 \text{ kJ mol}^{-1}$ for Si₂N(g), and $511 \pm 22 \text{ kJ mol}^{-1}$ for Si₃N(g). Exptl. and theor. bond dissociation energies were compared and discussed, indicating a strong bonding of N to Si₃.

Key 9 AM 4/4,

et pass

MacClellan

*Atom H,
ΔfH*

C.A. 1997, 124, N1

SiN

1993

$4.54 \leq D_0 \leq 4.82$

118: 110116e The dissociation energy] of the silicon nitride (SiN) radical determined from a crossed-molecular-beam study of the silicon + nitrous oxide → [silicon nitride + nitric oxide ($\text{Si} + \text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{SiN} + \text{NO}$) reaction. Naulin, Christian; Costes, Michel; Moudden, Zakaria; Ghanem, Naima; Derthe, Gerard (Photophysique et Photochimie / Mol., Univ. Bordeaux I, 33405 Talence, Fr.). *Chem. Phys. Lett.* 1993, 202(5), 452-8 (Eng.). The $\text{Si}({}^3\text{P}_j) + \text{N}_2\text{O}(X : \Sigma^+)$ → $\text{SiN}(X : \Sigma^+) + \text{NO}(X : \Pi_-)$ reaction was studied by using pulsed, crossed, supersonic mol. beams. The $\text{SiN}(X : \Sigma^+)$ product was probed by laser-induced fluorescence. The reaction exhibited a translational-energy threshold between 0.2 and 0.3eV. Detn. of the SiN population limit just above the threshold led to a reaction endoergicity of $0.12 \leq \Delta_{\text{D}} \leq 0.38$ eV, which combined with $D_0(\text{N}-\text{NO}) = 4.93 \pm 0.01$ eV gave $4.54 \leq D_0(\text{SiN}) \leq 4.82$ eV. This value is in agreement with the ab-initio result of L. A. Curtiss, et al. (1991) (4.58 eV) derived from the so-called Gaussian-2 theory. The validity of the exptl. approach is also discussed.

C.A. 1993, 118, N12

Si₂N

1995

1 Б316. Стандартная молярная энталпия атомизации и стандартная молярная энталпия образования газообразного Si₂N, определенные с помощью высокотемпературной масс-спектрометрии. The standard molar atomization enthalpy and the standard molar enthalpy of formation of gaseous Si₂N from high-temperature mass spectrometry / Viswanathan R., Schmude R. W., Gingerich K. A. // J. Chem. Thermodyn. — 1995. — 27, № 12. — С. 1303—1311. — Англ.

Б/п

Методом кнудсеновской эффузионной масс-спектрометрии исследовано испарение смеси кремния с нитридом бора из ячейки Кнудсена, изготовленной из нитрида бора, при т-рах 1688—1921К. Определены парц. давл. Si(g), Si₂(g), N₂(g) и Si₂N(g). С использованием новых термич. ф-ций для Si₂N(g) для энталпии р-ции диссоциации Si₂N(g)=2Si(g)+0,5N₂(g) получено $\Delta_fH^0=545,1 \pm 12,4$ кДж/моль при T=298,15К, а для энталпии атомизации при T=298,15К получено $\Delta_aH^0(Si_2N, g)=1017,8 \pm 12,4$ кДж/моль и для теплоты образования получено $\Delta_fH^0(Si_2N, g, 298,15K)=355,6 \pm 14,8$ кДж/моль.

В. Ф. Байбуз

X. 1997, № 1

SiN

2000

F: SiN (\mathcal{D}_6)

P: 1

03.03-19Б3.5. Энергии диссоциации астрофизически
важных [молекул] MgO, SO и TiO согласно
спектроскопическим данным. Dissociation energies of
astrophysically important MgO, SO, SiN and TiO from
spectroscopic data / R. R., Ahammed Y. Nazeer,
Gopal K. Rama, Azeem P. Abdul, Rao T. V. R. //
Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. - 2000. -
66, N 5. - С. 501-508. Англ.

Методом Ридберга-Клейна-Риса рассчитаны кривые
потенциальной энергии астрофизически значимых
молекул MgO, SO, SiN и TiO. С использованием
пятипараметрической функции Хулбурта-Хиршфельда
получены энергии диссоциации $D[0] = 3,674'+'0,075$;
 $5,321'+'0,113$; $4,492'+'0,103$ и $6,94'+'0,16$ эВ
соответственно, согласующиеся с экспериментом.

Si₃N₄

F: "гамма"-Si₃N₄ — = (T_{CZ} при высоких давл.)
P: 1

04.14-19Б3.95. Пост-шпинельные фазы нитрида кремния. Post-spinel phases o silicon nitride / Kroll P., Von Appen J. // Phys. status solidi. B. - 200 226, N 1. - С. R6-R7. - Англ.

С использованием модели функционала плотности рассчитали параметры структ нескольких гипотетич. фаз-шпинелей - модификаций высокого давления (их называют пост-шпинельными модификациями; недавно была синтезирована одна таких фаз - 'гамма'-Si[3]N[4]). Высказано предположение, что при давления свыше 160 ГПа может появляться фаза 'дельта'-Si[3]N[4], решетка которой содержит октаэдры и призмы SiN[6]. Библ. 8.